

RCJ 第2回
電子デバイスの信頼性シンポジウム
予稿集

1992年 11月

財団法人 日本電子部品信頼性センター

ご 挨拶

第2回 R C J信頼性シンポジウムが11月17日開催の電子デバイスの信頼性シンポジウムと18日の I E C環境試験方法と静電気の基礎講座、19日の E O S / E S Dシンポジウムの構成で開催される運びとなりました。

本 R C Jシンポジウムは、平成3年度から新しく始められたもので、急進展する電子デバイスの機能の大規模化及び超微細化のなかでさらに高信頼性の要求を実現することをねらい、電子部品・電子機器の信頼性評価技術に関する I E C規格の普及と併せて I E C新規格を提案する基礎資料の蓄積を図ることを目的に企業、大学、研究所の技術者の方々の参加の下に、自由に十分討議できる場を提供すべく設定されたものであります。幸い多くの方のご協力で第1回から180余名の参加を得て好評でありました。

第2回では、さらに充実をはかる企画の1つとして両シンポジウムの間18日に静電気の基礎講座と関連 T C国内委員の方々による I E C環境試験方法の紹介が行われ、パネル討論会もあって注目されるところであります。

SMD（表面実装部品）の信頼性評価技術と CMOS - I Cのラッチアップ現象の評価に重要な評価方法の標準化ならびに近年社会問題ともなっている E S D障害事故、静電気対策、E S D試験方法等緊急の課題が論じられます。

是非、若い技術者の多くの参加を得て、さらに稔り豊かな活動に盛り上げていきたいものであります。

最後に会場をはじめ色々のご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、関連 T C国内委員及び発表者各位、さらに協賛諸団体の方々に心からお礼申し上げます。

R C J信頼性シンポジウム運営委員会

委員長 後 川 昭 雄

第2回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集

目 次

座 長 崎 元 正 教 (株式会社 日立製作所)

(10:00 ~ 10:30)

- 2S-1 SMTのはんだ付信頼性品質改善 近藤 誠 1
(日本電気株式会社)

(10:30 ~ 11:00)

- 2S-2 実装・洗浄工程のSMDに与える影響 松島 博・佐原 隆一・水頭 智 7
(松下電子工業株式会社)

座 長 加 藤 治 郎 (東京電気株式会社)

(11:00 ~ 11:30)

- 2S-3 SMDハイブリッドICの信頼性 堀田 博志・笹川 敏一・北條 今人・岩谷 征夫 13
(富士通株式会社)

(11:30 ~ 12:00)

- 2S-4 積層構造配線のEM(エレクトロマイグレーション)特性 中村 愛子・福田 保裕・鉄田 博 19
(沖電気工業株式会社)

座 長 柳 沢 武 (電子技術総合研究所)

(13:00 ~ 13:30)

- 2S-5 チップタンタルコンデンサの信頼設計と安全設計 齋木 義彦・三谷 敏幸 25
(日本電気株式会社)

(13:30 ~ 14:00)

- 2S-6 アルミ電解コンデンサの長寿命化技術 池原園治郎・中田 卓美 33
(松下電子部品株式会社)

座 長 三 上 和 正 (東京都立工業技術センター)

(14:00 ~ 14:30)

- 2S-7 TSモード系セラミック発振子の信頼性 草開 重雅・安藤 勝義 41
(株式会社村田製作所)

(14:30 ~ 15:00)

- 2S-8 有機電子受容、供与体配合銅導電塗料の耐熱、耐湿性 谷野 克己・藤城 敏史・二口 友昭 47
(富山県工業技術センター機械電子研究所)
中村 稔・伊藤 治
(日本油脂㈱塗料研究所)

座 長 岡 本 英 男 (沖エンジニアリング株式会社)

(15:15 ~ 15:50)

2S-9 高度加速耐湿性試験に向けてのHAST装置 山本 敏男 55
(タバイエスベック株式会社)

(15:50 ~ 16:30)

2S-10 汚染ガス腐食試験における技術的考察 横井 康夫 63
(株式会社山崎精機研究所)